課題番号 :F-14-RO-0034

利用形態 :技術補助

利用課題名(日本語) :Ge を活性層とする薄膜トランジスタの形成(トンネル絶縁膜)

Program Title (English) : Fabrication of Ge TFT (thin film deposition)

利用者名(日本語) : <u>平野翔大</u> Username (English) : <u>S. Hirano</u>

所属名(日本語) : 兵庫県立大学大学院工学研究科

Affiliation (English) : University of Hyogo

#### 1. 概要(Summary)

トンネル絶縁膜に  $Al_2O_3/GeO_2$  積層膜を用いた Ge 共鳴トンネル MOS トランジスタの作製を目指し、 $Al_2O_3/GeO_2/Ge$  ゲートスタック構造を作製・評価した。

## 2. 実験(Experimental)

#### • 実験装置

酸化炉,汎用熱処理装置,分光エリプソメーター, 走査電子顕微鏡,スパッタ装置(Al用),LPCVD 装置(SiO<sub>2</sub>用)

## •実験方法

電子ビーム (EB) 蒸着法により 100nm の a-Ge 膜を石英基板上に蒸着した。試料を 1%HF 水溶液で処理した後、Ge の酸化を目的として、電気炉にて熱処理(大気中、500 $^{\circ}$ C、10min)を行った。真空蒸着法により Al 膜を10nm 蒸着し、Al の酸化を目的として、熱処理(大気中、500 $^{\circ}$ C、30min)を行った。

X 線光電子分光法 (XPS) により深さ方向分布を測定した。電極  $Al(100 \mu m \phi)$ を蒸着し、電気特性の評価を行った。また比較として、 $Al_2O_3/Ge$  積層構造、 $Al/GeO_2/Ge$  積層構造を作製し、同様に評価を行った。

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

比較のため作製した Al/GeO2/Ge 積層構造では Al/GeO2 界面付近の Al の酸化が見られ、GeO2の O が Al と反応していることが確認された。しかし Al は十分に酸化しておらず、Al の薄膜化もしくは Al 蒸着後の追加熱処理が必要であると考えられる。

 $Al_2O_3/GeO_2/Ge$  積層構造の Ge3d および Al2p 付近の XPS スペクトルを Fig.1(a)、(b)にそれぞれ示す。Al2p 付近の XPS スペクトルから  $Al_2O_3$  を形成していると考えられる。Ge3d 付近の XPS スペクトルから、 $GeO_2/Ge$  構造も形成できていると考えられる。

また各積層構造の I-V 特性を Fig.2 に示す。  $Al_2O_3/GeO_2/Ge$  積層構造では絶縁破壊電圧 150V、リーク電流  $4.7\times10^{-12}A(20V)$ という比較的良好な特性を示した。

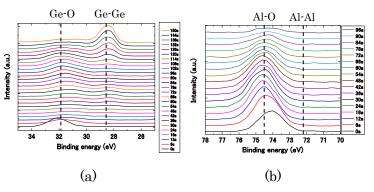


Fig.1 XPS spectra of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GeO<sub>2</sub>/Ge structure. (a) Ge3d. (b) Al<sub>2</sub>p.

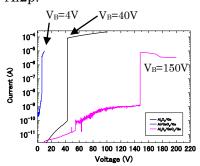


Fig.2 I-V characteristics of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Ge, Al/GeO<sub>2</sub>/Ge and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GeO<sub>2</sub>/Ge structure.

## 4. その他・特記事項(Others)

共同研究者

松尾 直人(兵庫県立大学)

部家 彰(兵庫県立大学)

# 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) なし。

#### 6. 関連特許(Patent)

なし。